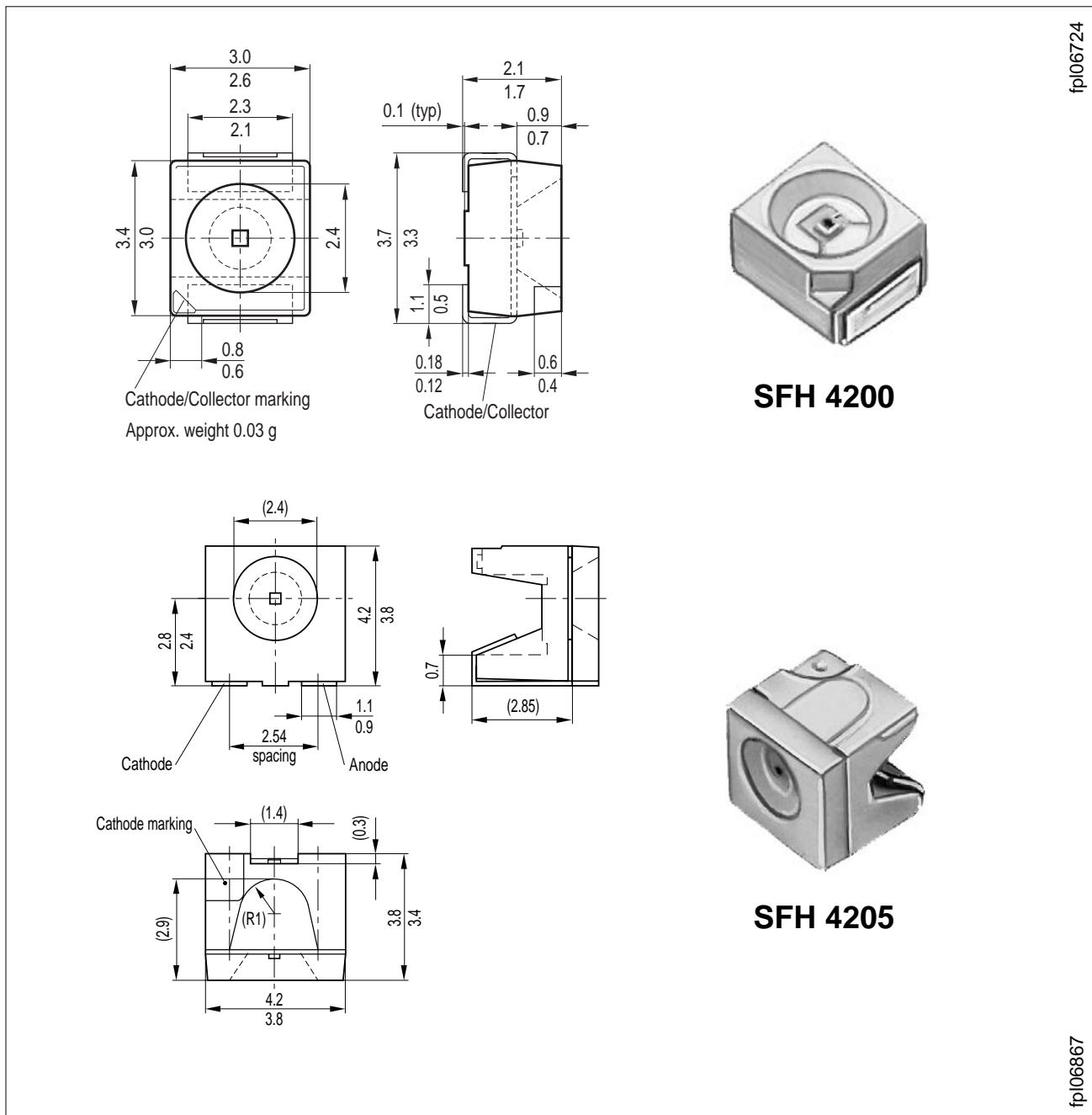


**Schnelle GaAs-IR-Lumineszenzdiode (950 nm)
High-Speed GaAs Infrared Emitter (950 nm)**

**SFH 4200
SFH 4205**



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

Wesentliche Merkmale

- Hohe Pulsleistung sowie hoher Gesamtstrahlungsfluß Φ_e
- Sehr kurze Schaltzeiten (10 ns)
- Sehr hohe Langzeitstabilität
- Hohe Zuverlässigkeit

Features

- High pulse power and high radiant flux Φ_e
- Very short switching times (10 ns)
- Very high long-time stability
- High reliability

Anwendungen

- Schnelle Datenübertragung mit Übertragungsraten bis 100 Mbaud (IR Tastatur, Joystick, Multimedia)
- Analoge und digitale Hi-Fi Audio- und Videosignalübertragung
- Batteriebetriebene Geräte (geringe Stromaufnahme)
- Anwendungen mit hohen Zuverlässigkeit ansprüchen bzw. erhöhten Anforderungen
- Alarm- und Sicherungssysteme
- IR Freiraumübertragung

Applications

- High data transmission rate up to 100 Mbaud (IR keyboard, Joystick, Multimedia)
- Analog and digital Hi-Fi audio and video signal transmission
- Low power consumption (battery) equipment
- Suitable for professional and high-reliability applications
- Alarm and safety equipment
- IR free air transmission

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code	Gehäuse Package
SFH 4200	Q62702-P978	Kathodenkennzeichnung: abgesetzte Ecke Cathode marking: bevelled edge TOPLED®
SFH 4205	Q62702-P5165	SIDELED

Grenzwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**Maximum Ratings**

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	- 40... + 100	°C
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	3	V
Durchlaßstrom Forward current	I_F (DC)	100	mA
Stoßstrom, $t_p = 10 \mu\text{s}$, $D = 0$ Surge current	I_{FSM}	1	A
Verlustleistung Power dissipation	P_{tot}	180	mW
Wärmewiderstand Sperrsicht - Umgebung bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 16 mm^2 Thermal resistance junction - ambient mounted on PC- board (FR4), padszie 16 mm^2 each	R_{thJA}	450	K/W
Wärmewiderstand Sperrsicht - Lötstelle bei Montage auf Metall-Block Thermal resistance junction - soldering point, mounted on metal block	R_{thJS}	200	K/W

Kennwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**Characteristics**

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge der Strahlung Wavelength of peak emission $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$	λ_{peak}	950	nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von I_{max} Spectral bandwidth at 50% of I_{max} $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$	$\Delta\lambda$	40	nm
Abstrahlwinkel Half angle	ϕ	± 60	Grad deg.
Aktive Chipfläche Active chip area	A	0.09	mm^2
Abmessungen der aktiven Chipfläche Dimension of the active chip area	$L \times B$ $L \times W$	0.3×0.3	mm
Schaltzeiten, I_e von 10% auf 90% und von 90% auf 10%, bei $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$, $R_L = 50 \Omega$ Switching times, I_e from 10% to 90% and from 90% to 10%, $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$, $R_L = 50 \Omega$	t_r, t_f	10	ns
Durchlaßspannung Forward voltage $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$ $I_F = 1 \text{ A}, t_p = 100 \mu\text{s}$	V_F V_F	1.5 (≤ 1.8) 3.2 (≤ 3.6)	V V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 3 \text{ V}$	I_R	0.01 (≤ 10)	μA
Gesamtstrahlungsfluß Total radiant flux $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$	Φ_e	28	mW
Temperaturkoeffizient von I_e bzw. Φ_e , $I_F = 100 \text{ mA}$ Temperature coefficient of I_e or Φ_e , $I_F = 100 \text{ mA}$	TC_I	- 0.44	%/K
Temperaturkoeffizient von V_F , $I_F = 100 \text{ mA}$ Temperature coefficient of V_F , $I_F = 100 \text{ mA}$	TC_V	- 1.5	mV/K
Temperaturkoeffizient von λ , $I_F = 100 \text{ mA}$ Temperature coefficient of λ , $I_F = 100 \text{ mA}$	TC_λ	+ 0.2	nm/K

Strahlstärke I_e in Achsrichtunggemessen bei einem Raumwinkel $\Omega = 0.01 \text{ sr}$ **Radiant intensity I_e in axial direction**at a solid angle of $\Omega = 0.01 \text{ sr}$

Bezeichnung Description	Symbol	Werte Values	Einheit Unit
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$	$I_{e \min}$ $I_{e \text{ typ}}$	4 8.5	mW/sr
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 1 \text{ A}, t_p = 100 \mu\text{s}$	$I_{e \text{ typ}}$	55	mW/sr

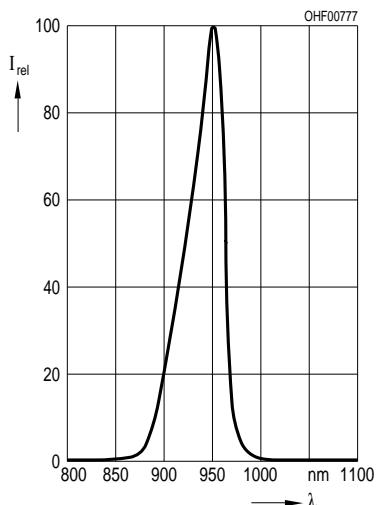
Löthinweise**Soldering conditions**

Baiform Types	Tauch-, Schwall- und Schleplötung Dip, wave and drag soldering		Reflowlötung Reflow soldering	
	Lötbad-temperatur Temperature of the soldering bath	Maximal zulässige Lötzeit Max. perm. soldering time	Lötzonen-temperatur Temperature of soldering zone	Maximale Durchlaufzeit Max. transit time
TOPLED	260 °C	10 s	245 °C	10 s
SIDELED	–	–	245 °C	10 s

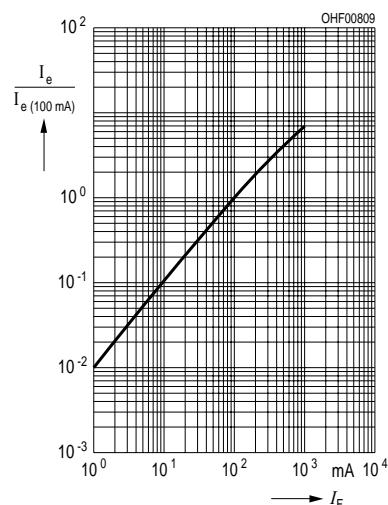
Zusätzliche Informationen über allgemeine Lötbedingungen auf Anfrage.

Additional information on general soldering conditions on request.

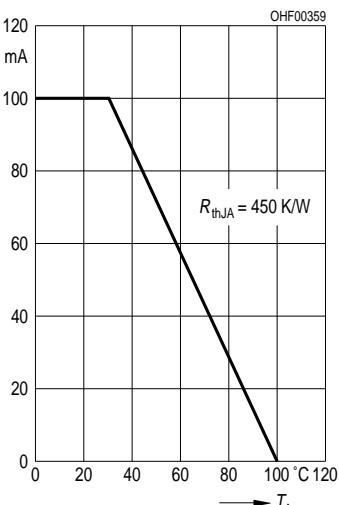
Relative spectral emission
 $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$



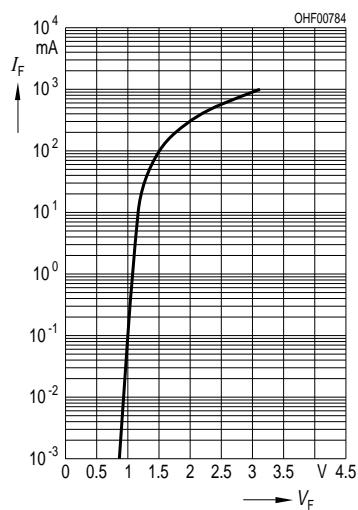
Radiant intensity $\frac{I_e}{I_e \text{ 100 mA}} = f(I_F)$
 Single pulse, $t_p = 20 \mu\text{s}$



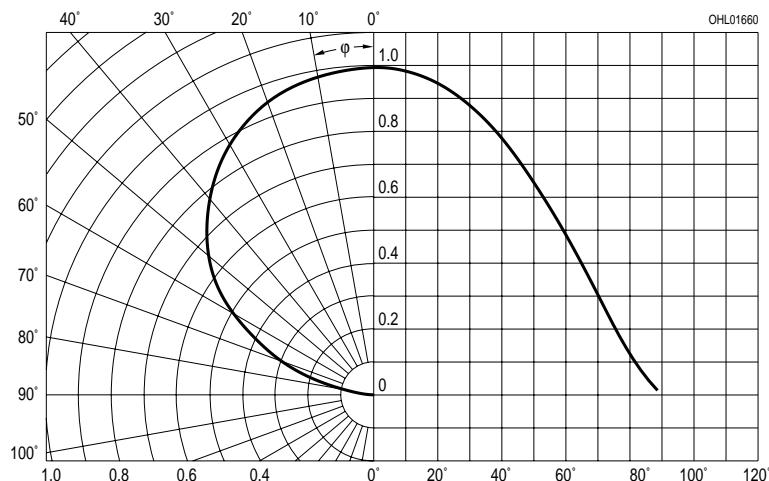
Max. permissible forward current
 $I_F = f(T_A), R_{\text{thJA}}^{(1)}$



Forward current $I_F = f(V_F)$
 single pulse, $t_p = 20 \mu\text{s}$



Radiation characteristics $I_{\text{rel}} = f(\phi)$



⁽¹⁾ Thermal resistance junction - ambient mounted on PC-board (FR4), pad size 16 mm² (each).